

(12)

Recherchenbericht

(Österreichische Patentanmeldung)

(21) Anmeldenummer: A 71/2011
(22) Anmeldetag: 19.01.2011
(88) Recherchenbericht
veröffentlicht am: 15.02.2014

(51) Int. Cl. : **A61B 3/10** (2006.01)

(56)

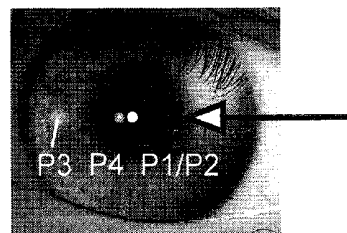
Kontrolliert kippen:
Silizium Mikrospiegel mit integriertem optischen
Feedback
von David Kallweit, Wolfgang Mönch et al.
Universität Freiburg, IMTEK
Zeitschrift Photonik 4/2006
Seiten 2-5
<http://www.imtek.de/content/pdf/public/2006/photonik-04-2006-kallwei1.pdf>
vom Internet heruntergeladen am 28.11.2011

(73) Patentanmelder:
FERCHER ADOLF FRIEDRICH DR.
1230 WIEN (AT)

(72) Erfinder:
FERCHER ADOLF FRIEDRICH DR.
WIEN (AT)

(54) **OPTISCHER ADAPTER FÜR EIN DOPPELSTRAHL KURZKOHÄRENZ-INTERFEROMETRIE VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR INTRAOKULÄREN DISTANZMESSUNG**

(57) Die Messung intraokulärer Distanzen, wie der okulären Achslänge und von Distanzen in der Vorderkammer, ist von grosser Wichtigkeit in der Ophthalmologie. Moderne, berührungsfrei arbeitende Instrumente arbeiten mit Kurzkohärenz-Interferometrie. Während die Kurzkohärenz-interferometrische Achslängenmessung schon gut beherrscht wird, hat sich die Messbarkeit von Distanzen der Vorderkammer als deutlich schwieriger herausgestellt. Die zugrunde liegenden Probleme werden durch einen optische Adapter in einem Doppelstrahl Kurzkohärenz-Interferometer gelöst, der für Beleuchtungsstrahl und Messstrahl variable Strahldurchmesser, variable Strahl-Konvergenzen, variable Schrägen, variable Azimute und variable räumliche Positionen der zugrunde liegenden Purkinje-Bilder einzustellen erlaubt.



Figur 1



| Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß IPC: A61B 3/10 (2006.01) | | |
|--|---|---|
| Klassifikation des Anmeldungsgegenstands gemäß ECLA: A61B 3/10 | | |
| Recherchiertes Prüfobjekt (Klassifikation): A61B internet | | |
| Konsultierte Online-Datenbank: epodoc, X-full | | |
| Dieser Recherchenbericht wurde zu den am 19. Jänner 2011 eingereichten Ansprüchen erstellt. | | |
| Kategorie ¹⁾ | Bezeichnung der Veröffentlichung: Ländercode, Veröffentlichungsnummer, Dokumentart (Anmelder), Veröffentlichungsdatum, Textstelle oder Figur soweit erforderlich | Betreffend Anspruch |
| A | Kontrolliert kippen: Silizium Mikrospiegel mit integriertem optischen Feedback von David Kallweit, Wolfgang Mönch et al. Universität Freiburg, IMTEK Zeitschrift Photonik 4/2006 Seiten 2-5 http://www.imtek.de/content/pdf/public/2006/phononik-04-2006-kallweil.pdf vom Internet heruntergeladen am 28.11.2011 | 1 |
| Datum der Beendigung der Recherche: 29. November 2011 | | <input type="checkbox"/> Fortsetzung siehe Folgeblatt |
| | | Prüfer(in): ZAWODSKY R. |
| ¹⁾ Kategorien der angeführten Dokumente: X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: der Anmeldegegenstand kann allein aufgrund dieser Druckschrift nicht als neu bzw. auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden. Y Veröffentlichung von Bedeutung: der Anmeldegegenstand kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren weiteren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist. A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert. P Dokument, das von Bedeutung ist (Kategorien X oder Y), jedoch nach dem Prioritätstag der Anmeldung veröffentlicht wurde. E Dokument, das von besonderer Bedeutung ist (Kategorie X), aus dem ein älteres Recht hervorgehen könnte (früheres Anmeldedatum, jedoch nachveröffentlicht, Schutz ist in Österreich möglich, würde Neuheit in Frage stellen). & Veröffentlichung, die Mitglied der selben Patentfamilie ist. | | |